

---

# Rasterelektronenmikroskop

---

## Prinzip:

Abbildung bei hohen Vergrößerungen und Elementanalyse.

<b>Hersteller</b>	Carl Zeiss NTS GmbH
<b>Elektronenquelle</b>	Wolframglühkathode
<b>Beschleunigungsspannung</b>	200 - 30 000 V
<b>Auflösung</b>	max. 3 nm bei 30 kV
<b>Vakuum</b>	$10^{-7}$ - $10^{-6}$ mbar
<b>Detektoren</b>	SE, BSE
<b>EDX-Detektor</b>	10 mm <sup>2</sup> Si(Li)
<b>Analysierbare Elemente</b>	ab Be
<b>Analysemöglichkeiten</b>	Punkt, Linie, Fläche
<b>Max. Probenmasse</b>	2 kg
<b>Probenanzahl</b>	max. 9